GaN における放射線検出特性の実験的評価

Evaluation of radiation detection characteristic for GaN

静大院工¹,名大院工²,赤崎リサーチセンター³,静大電研⁴, °杉浦睦仁¹,久志本真希²,光成正², 山下康平²,本田善央²,天野浩^{2,3},三村秀典⁴,井上翼¹,青木徹⁴,中野貴之¹

°Mutsuhito Sugiura¹, Maki Kushimoto², Tadashi Mitsunari², Kohei Yamashita², Yoshio Honda²,

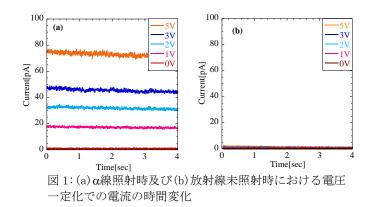
Hiroshi Amano^{2,3}, Hidenori Mimura⁴, Yoku Inoue¹, Toru Aoki⁴, Takayuki Nakano¹ Shizuoka Univ., ²Nagoya Univ., ³Akasaki Research Center, ⁴R.I.E. Shizuoka Univ.

°E-mail: sugiura@cnt.eng.shizuoka.ac.jp

緒言 近年、中性子イメージング技術への期待から中性子検出半導体材料の開発が盛んに行われている。我々は中性子捕獲断面積が大きい Gd 原子や B 原子がIII 族原料であることに着目し、III 族原子の混晶化が可能であり γ 線に対する感度が低い GaN を母材に用いた GdGaN や BGaN による中性子検出半導体を提案している[1]。しかしながら、GaN などのIII 族窒化物半導体材料に関する放射線検出特性は十分なデータが得られていない。そこで、本研究では GaN の α 線及び γ 線に対する検出感度を調べることにより、GaN の放射線検出特性を実験的に評価したので報告する。

実験方法 本研究では、有機金属気相エピタキシー(MOVPE)法を用いて作製した GaN ダイオードを 用いて放射線検出特性を評価した。放射線照射実験においては ²⁴¹Am 線源を用いたα線及びγ線照射時 の電流-電圧測定を行った。

結果と考察 最初に、ショットキーダイオードを用いて α 線検出感度を評価した。図 1 に α 線照射時と放射線未照射時における電圧一定下での電流値の時間変化を示す。 α 線照射時において検出電流が増加していることが確認でき、印加電圧の増加により検出電流値の増加量が増大していることが確認できた。しかしながら、十分な有感層が形成されていないため pA オーダーの増加量であった。そこで、十分な有感層領域を得るために pn ダイオードを作製し評価を行った。IV 測定を行い放射線未照射時と放射線照射時(α 線およびy線)の検出電流の増加量を測定した。測定結果を図 2 に示す。y線照射時における電流値の増加に対して、 α 線照射時における電流の増加量は十分に大きい値を示した。更に、印加電圧を上げることで有感層領域の増加と取り出し効率の向上により増加した電流量が大きくなることが確認できた。これらの結果は GaN が放射線照射において α 線のみを選択的に検出することが可能であることを示しており、放射線検出素子としての可能性が示唆された。



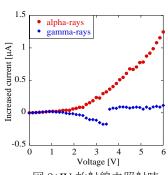


図 2:IV 放射線未照射時 と放射線照射時(α線およ びγ線)の電流の増加量

参考文献: [1] K. Atsumi, et al., APL Mater. 2 032106 (2014)

謝辞:本研究は科研費補助金(若手研究(A):24686014)の助成を受けたものである。